05;07

УФ-спектр поглощения наночастиц диоксида титана, аблированных лазерным излучением

© М.А. Пугачевский

Институт материаловедения Хабаровского научного центра ДО РАН Дальневосточный университет путей сообщения, Хабаровск E-mail: pmaximal@mail.ru

Поступило в Редакцию 25 апреля 2012 г.

Исследуются спектры поглощения ультрафиолетового (УФ) излучения наночастицами диоксида титана, полученными методом лазерной абляции. На основе анализа спектров определяется ширина запрещенной зоны частиц и влияние на нее различных факторов, таких как интенсивность лазерного излучения при получении наночастиц и температура последующего отжига частиц в печи. Обсуждается зависимость положения пиков на УФ-спектрах от типа дефектов в структуре наночастиц.

В последнее время широкое распространение получили исследования физико-химических свойств наночастиц диоксида титана, полученных различными методами [1–3]. Данный материал отличается высокой химической активностью при ультрафиолетовом облучении, что позволяет использовать его в качестве катализаторов реакций [4,5], активного компонента солнечных элементов [6,7] и др. Как известно, активность наночастиц TiO₂ по сравнению с объемным материалом значительно выше, что связано с увеличением площади активной поверхности. В предыдущих работах [8,9] было показано, что наночастицы оксидной керамики можно получать методом лазерной абляции.

УФ-облучение наночастиц диоксида титана за счет поглощения энергии фотонов приводит к генерации электронно-дырочных пар, участвующих в каталитических процессах на поверхности частиц. Данный процесс, как правило, сопровождается обратным явлением — рекомбинацией носителей зарядов. Установлено, что вероятность рекомбинации электронно-дырочных пар зависит от ширины запрещенной зоны (E_g) полупроводника [10]. Чем больше E_g , тем меньше вероятность перехода

53

электронов из зоны проводимости в валентную зону. С другой стороны, использование полупроводников с малой E_g позволяет увеличить долю полезной энергии при облучении TiO₂ солнечным светом, поскольку для возбуждения электронов из валентной зоны будут требоваться фотоны с более низкой энергией [11]. В связи с этим становятся актуальными исследования, посвященные выявлению факторов, влияющих на изменение ширины запрещенной зоны наночастиц. Диоксид титана является широкозонным полупроводником с E_g порядка 3–3.3 eV, что позволяет использовать УФ-спектр поглощения наночастиц TiO₂ для определения E_g по краю собственного поглощения [12]. Целью данной статьи является получение и последующий анализ ультрафиолетового спектра поглощения наночастиц TiO₂, а также исследование изменений УФ-спектра в результате отжига наночастиц в диапазоне температур от 400 до 1200°C.

Наночастицы были получены путем абляции мишени диоксида титана импульсным излучением с помощью твердотельного YAG : Nd³⁺ лазера с длиной волны 1.06 μ m, входящего в состав лазерного комплекса КВАНТ-15. Интенсивность излучения варьировалась в пределах от 10⁹ до 10¹⁰ W/m², длительность импульсов 4 ms, частота следования — от 1 до 25 Hz. В качестве мишени для лазерной абляции был использован сплавленный химически чистый порошок TiO₂. В процессе лазерной абляции наночастицы диоксида титана осаждались на предметные стекла, расположенные на расстоянии 10 mm от мишени. Время распыления варьировали от 1 до 10 min.

Температурную обработку аблированных частиц TiO₂ производили на воздухе в печи СНОЛ-0.2/1250 в диапазоне температур от 400 до 1200°С. Время отжига составляло 3 h, что, как показано в работе [9], достаточно для протекания фазовых превращений.

Полученные наночастицы TiO₂ изучали с помощью атомно-силового микроскопа Ntegra Prima. Оптические свойства наночастиц Ti₂ исследовали с помощью спектрометрического комплекта оборудования "ОКБ СПЕКТР" на основе монохроматора MДР-41, спектральный диапазон которого лежит в пределах от 200 до 25000 nm. В качестве источника излучения применялась дейтериевая лампа. Ширина запрещенной зоны наночастиц TiO₂ определялась по краю собственного поглощения полупроводника.

Исследования оптической микроскопии показали, что аблированные наночастицы TiO₂ на поверхности подложки формируют сплошное,



── 200 nm

Рис. 1. АСМ изображение наночастиц TiO_2 , полученных методом лазерной абляции при мощности 10^9 W/m^2 .

равномерное покрытие белого цвета. Размер частиц, согласно исследованиям атомно-силовой микроскопии (ACM), зависит от мощности лазерного излучения (ЛИ). Так, при мощности 10^{10} W/m² средний размер частиц составляет 10 nm, а при 10^9 W/m² — 40 nm (рис. 1).

Анализ оптических спектров пропускания и отражения в диапазоне длин волн от 200 до 400 nm позволил определить УФ-спектр поглощения наночастиц TiO₂ (рис. 2). Как показали исследования, форма спектра зависит от интенсивности лазерного излучения (ЛИ) в процессе лазерной абляции. Так, для частиц, аблированных при 10^{10} W/m², на спектре (рис. 2, *a*) наблюдается пик в области 340 nm (3.64 eV). При более низких интенсивностях ЛИ 10^9 W/m² пик на 340 nm уменьшается, а в области 390 nm (3.18 eV) появляется другой пик (рис. 2, *b*). Согласно результатам, представленным в работах [3,13], данные пики можно отнести: 340 nm — к несвязывающим O2p состояниям, а 390 nm — к Тi3d состояниями в энергетической структуре наночастиц.

По краю собственного поглощения на У Φ -спектре поглощения была определена E_g наночастиц ТіО₂. Для частиц, аблированных как при



Рис. 2. Спектр поглощения наночастиц диоксида титана, аблированных при мощности лазерного излучения 10^{10} W/m² (*a*) и 10^{9} W/m²(*b*). *I* — без отжига; *2* — после отжига 400°С.

 10^{10} W/m², так и при 10^9 W/m², E_g составила 3.5 ± 0.05 eV (355 nm). Аналогичные результаты были получены в работе [14]. Они показали, что для наночастиц TiO₂, синтезированных золь-гель технологией, E_g составляет 3.55 eV.

Исследования наночастиц TiO_2 , подвергнутых температурной обработке в печи, показали, что отжиг наночастиц в диапазоне температур от 400 до 1000°С ведет к изменению их оптических свойств. Так, с увеличением температуры цвет наночастиц TiO_2 меняется от белого к желтому, преимущественно за счет увеличения поглощения голубой части видимого спектра.



Рис. 3. Зависимость ширины запрещенной зоны от температуры отжига частиц TiO₂, аблированных при мощности лазерного излучения: $I - 10^{10} \text{ W/m}^2$; $2 - 10^9 \text{ W/m}^2$.

На рис. 3 представлен график зависимости от температуры отжига E_g наночастиц TiO₂, аблированных при различной мощности ЛИ. Как показывают результаты иследований, с увеличением температуры отжига E_g уменьшается. Данный результат можно объяснить следующим образом. В работе [9] было установлено, что температурный отжиг ведет к увеличению размеров наночастиц. С другой стороны, в работах [3,15,16] отмечено, что увеличение размеров наночастиц сопровождается уменьшением E_g , что согласуется с нашим экспериментом. Как видно из рисунка, обработка частиц в печи при 1000°С приводит к уменьшению E_g до 3 ± 0.05 eV.

Форма УФ-спектра поглощения после температурной обработки также изменяется. После отжига при 400°С пик О2р значительно уменьшается по интенсивности, в то время как пик Ті3d практически не изменяется (рис. 2). К постепенному снижению интенсивности пика Ті3d приводит отжиг лишь при температуре свыше 600°С. Динамика изменений пиков О2р и Ті3d на УФ-спектрах поглощения может свидетельствовать о наличии структурных дефектов титана или кислорода в поверхностных слоях наночастиц [13]. В работах [17–19] показано, что энергия активации дефектов кислорода значительно меньше, нежели титана. Как видно из рис. 2, после отжига при 400°С

пик O2p значительно уменьшается, в то время как пик Ti3d практически не изменяется. Данный факт позволяет предположить, что пик O2p преимущественно связан с дефектами кислорода, в то время как Ti3d главным образом с дефектами татана.

Таким образом, можно заключить, что в процессе лазерной абляции формируются наночастицы TiO_2 с шириной запрещенной зоны $3.5 \pm 0.05 \text{ eV}$. Температурный отжиг аблированных частиц ведет к уменьшению E_g до $3 \pm 0.05 \text{ eV}$ (при 1000° C). Пики O2p и Ti3d, выявляемые на спектрах поглощения наночастиц, связаны с дефектами кислорода и титана соответственно.

Работа выполнена при поддержке Президиума ДВО РАН (грант № 12-III-В-02-019).

Список литературы

- [1] Choi H.C., Ahn H.J., Jung Y.M. et al. // Appl. Spectrosc. 2004. V. 58. P. 598-602.
- [2] Sakai N., Ebina Y., Takada K. et al. // Am. Chem. Soc. 2004. V. 126. P. 5851-5858.
- [3] Chen X., Mao S. // Chem. Rev. 2007. V. 107. P. 2891–2959.
- [4] Snider G., Ariya P. // Chem. Phys. Lett. 2010. V. 491. P. 23-28.
- [5] Peng T., Zhao D., Dai K. et al. // J. Phys. Chem. B. 2005. V. 109. P. 4947-4952.
- [6] Richards B.S. // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2003. V. 79. P. 369-378.
- [7] Gratzel M.J. // Photochem. Photobiol. C. 2003. V. 4. P. 145-154.
- [8] Пугачевский М.А., Заводинский В.Г., Кузьменко А.П. // ЖТФ. 2011. Т. 81.
 В. 2. С. 98–102.
- [9] Пугачевский М.А. // Письма в ЖТФ. 2012. Т. 38. В. 7. С. 56-63.
- [10] Hoffmann M.R., Martin S.T., Choi W. et al. // Chem. Rev. 1995. V. 95. P. 69-96.
- [11] Зайнулина В.М., Жуков В.П., Красильников В.Н. и др. // ФТТ. 2010. Т. 52.
 В. 2. С. 253–261.
- [12] Пихтин А.Н., Хегазин Х.Х. // ФТП. 2009. Т. 43. В. 10. С. 1301–1307.
- [13] Laidani N., Cheyssac P., Perriere J. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2010. V. 43.
 P. 485402–485414.
- [14] Karthik S.N., Prabakar K., Subramania A. et al. // Powder Technology. 2011.
 V. 205. P. 36–41.
- [15] Li Y., White T.J., Lim S.H. // J. Solid State Chem. 2004. V. 177. P. 1372-1381.
- [16] Reddy K.M., Reddy C.V.G., Manorama S.V.J. // Solid State Chem. 2001. V. 158. P. 180–186.

- [17] Na-Phattalung S., Smith M.F., Kim K. et al. // Phys. Rev. B. 2006. V. 73.
 P. 125205–125217.
- [18] Mowbray D.J., Martinez J.I., Garcia J.M. et al. // J. Phys. Chem. C. 2009. V. 113. P. 12301–12308.
- [19] Aschauer U., He Y., Cheng H. et al. // J. Phys. Chem. C. 2010. V. 114. P. 1278–1284.